

Nemzetközi konferencia és kiállítás ipari mérés és ellenőrzésről sugárzási technikák alkalmazásával

1972. április 11—13. között az angliai Villamosmérnökök Szervezete (IEE), valamint a Tudományos Műszergyártók Szövetsége (SIMA) a Surrey-i Egyetemen megrendezte a címben megjelölt konferenciát és kiállítást. A rendezvény támogatói között szerepeltek a Villamos- és Elektronikai Mérnökök Szervezetének (IEEE) angliai és ír szekciója, a Mérés és Automatizálási Egyesület (IMC), a Fizikai Társaság, valamint az Elektronikai és Rádiómérnökök Szervezete (IERE).

A konferencián 38 előadás hangzott el, az előadók közül 30 angliai, 2 svájci, 3 osztrák, 2 svéd–finn, egy szerzőcsoport pedig NSZK intézményt képviselt.

A szerzők az ismertetett, sugárzás-anyag kölcsönhatáson alapuló mérési eljárásokat — csaknem kivétel nélkül — valamely konkrét gyártástechnológiai ellenőrzési feladatra (bevonatok rétegvastagságának mérése, folyadékok szintmérése, szennyezők kimutatása, kémiai összetétel meghatározása, poranyagok szemcseméretének megállapítása stb.) alkalmaz-

ták. Az előadások azt tükrözték, hogy legáltalánosabban a röntgenfluoreszcencia- és neutronaktivációs analízis terjedt el, de több szerző számolt be emissziós és infraszpektroszkópiai, ritkábban lángfotometriás mérési eljárások ipari alkalmazásáról, továbbá az elektronsugaras mikroanalízis szerepéről a technológiai folyamatban feldolgozásra kerülő heterogén összetételű anyagok morfológiájának és kémiai összetételének megállapításában. Említésre méltó, hogy 3 előadásban is foglalkoztak a mikrohullámú sugárzás — anyag kölcsönhatáson alapuló változások felhasználásával ipari folyamatok ellenőrzésére, pl. folyadékszintmérésre, bevonat vastagságmérésre és nedvességtartalom-mérésre. Néhány előadásban részletesebb áttekintést adtak a fontosabb sugárzás — anyag kölcsönhatást hasznosító mérési módszerekről. A konferencia előadásai jól szemléltetik, hogy a korszerű technológiák feltételezik az alapos, sokoldalú és állandóan továbbfejlesztett anyagvizsgálatot.

Dr. Kormány Teréz